



ウェハー厚みデータ閲覧ソフトウェア「WaferDataViewer」のご紹介

1. 概要機能

- ・測定器から出力されたデータ(※1)を読み出して、最小値,最大値,平均値等を算出し、画面に表示します。また、処理前・処理後のデータから差分値を算出して、別のファイルに保存する事も可能です。
- ・読込んだデータを二次元マップや断面グラフ、3次元マップで閲覧が可能です。
- ・読込んだデータをCSV形式(カンマ区切り)(※2)でエクスポートできます。

※1…測定器のメーカーや出力形式は別途ご相談とさせていただきます。

※2…エクスポート形式については他の形式にも対応可能です。

2. 動作環境

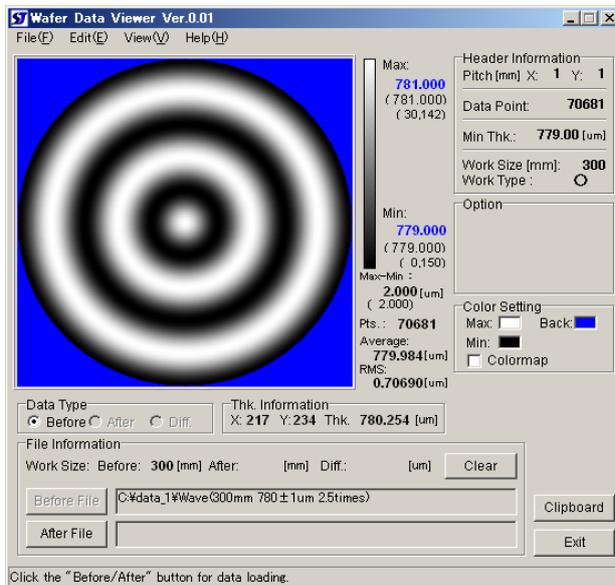
本ソフトウェアの動作環境は下記の通りです。

対応OS	Microsoft Windows2000、Windows XP、Windows Vista、Windows7(日本語版)
CPU	Intel Pentium® 133MHz以上
メモリ	512MB以上
HDD空き容量	500MB以上
周辺機器	マウスが使用可能な事

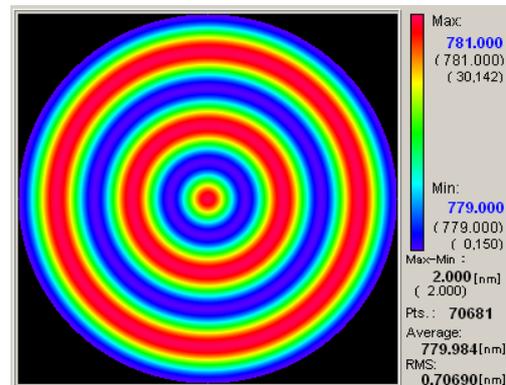
3. 画面表示例

・メイン画面

データの読み出しや他のウィンドウを呼び出しを行う為の画面です。画面の左上に読み出したデータが二次元マップで表示されます。表示色は指定した2色間のグラデーションかカラーマップのどちらかを選択できます。



メイン画面(白⇄黒グラデーション表示)



二次元マップ(カラーマップ表示)

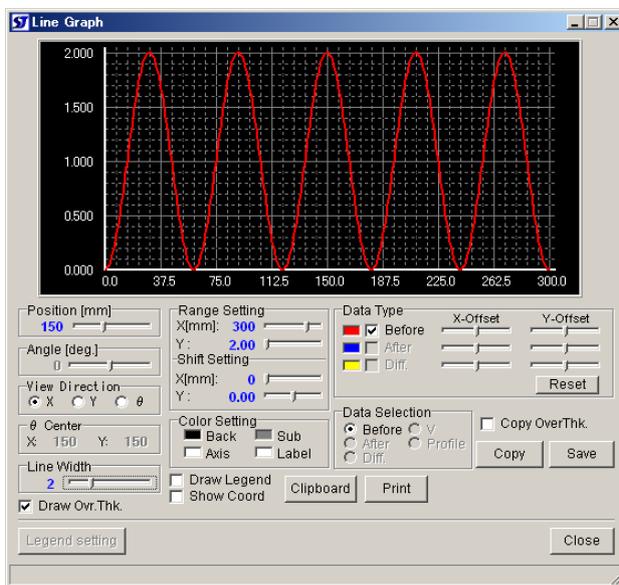


・断面グラフ表示画面

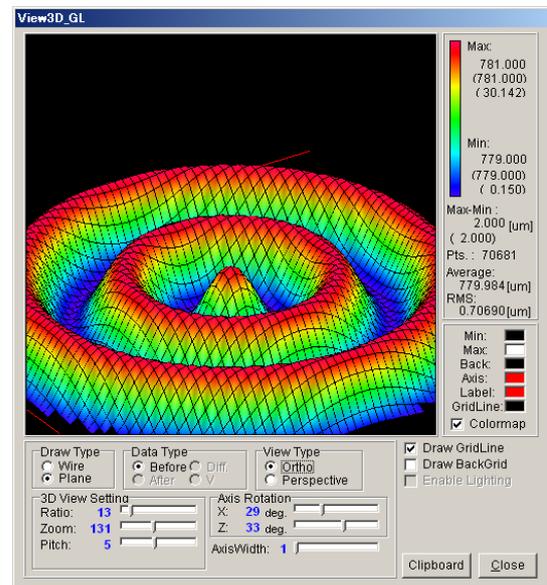
読込んだデータを断面グラフで閲覧できます。
断面座標や断面方向の調節も行えます。また、表示中の断面のデータをクリップボードにコピーして他のアプリケーションにコピーする事も可能です。

・3次元マップ表示画面

読込んだデータを3次元マップで閲覧できます。
マウス操作で拡大/縮小や視野の回転等を直感的に行えます。
3次元グラフの描画には高速描画が可能なOpenGLライブラリを採用しております。



断面グラフ画面



3次元マップ表示画面

尚、上記両画面共に、グラフの描画部のイメージをクリップボードにコピーして、画像を他のアプリケーションに貼り付けることも可能です。

・その他機能

- ・読み込んだデータに対して、回転や上下/左右反転、データ全体への四則演算、平均フィルタ、データカット(E.E.、オリフ)等の編集操作が可能です。
- ・チップサイズに区切ったサイト(領域)内のSBIR/SFQRを算出して表示する事が可能です。
また、算出したサイト毎の値をクリップボードにコピーして、他のアプリケーションにコピーする事が可能です。

標準のデータピッチは1mmとなりますが、これ以外のピッチのデータについても対応可能ですので、その他の機能の追加要望等と併せまして、ご相談下さい。